

CEI 60749-11  
(Première édition – 2002)

**DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –  
MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES  
ET CLIMATIQUES –**

**Partie 11: Variations rapides de température –  
Méthode des deux bains**

IEC 60749-11  
(First edition – 2002)

**SEMICONDUCTOR DEVICES –  
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –**

**Part 11: Rapid change of temperature –  
Two-fluid-bath method**

## **CORRIGENDUM 2**

Page 2

*Au lieu de:*

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2012.

*lire:*

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

Page 3

*Instead of:*

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2012.

*read:*

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.

**Document Preview**

[IEC 60749-11:2002/COR2:2003](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/3be2181a-25e4-4dc8-834f-f9e774264743/iec-60749-11-2002-cor2-2003)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/3be2181a-25e4-4dc8-834f-f9e774264743/iec-60749-11-2002-cor2-2003>